# SnSe 分子外场下的基态性质和激发态性质\*

王藩侯† 黄多辉 杨俊升

(直宾学院,计算物理四川省高等学校重点实验室, 直宾 644000)(2012年9月11日收到; 2012年12月4日收到修改稿)

对 Sn 原子使用 SDB-cc-pVTZ 基组, Se 原子采用 6-311++G\*\* 基组, 利用密度泛函中的 B3LYP 方法研究了电场 强度为 -0.04—0.04 a.u. 的外电场对 SnSe 基态分子的几何结构、电荷布居分布、HOMO 能级、LUMO 能级、能 隙、费米能级、谐振频率和红外光谱强度的影响. 继而使用含时密度泛函 (TD-B3LYP) 方法研究了 SnSe 分子在外 场下的激发特性. 结果表明, 外电场的大小和方向对 SnSe 分子基态的这些性质有明显影响. 在所加的电场范围内 (-0.04 a.u.—0.04 a.u.), 随着正向电场的增大, 核间距先减小后增大, 在 F = 0.03 a.u. 时取得最小值 0.2317 nm; 分子 电偶极矩  $\mu$  近似线性地增大;  $E_L$ ,  $E_H$ 、费米能级  $E_F$  和能隙  $E_g$  均减小. 随着正向电场逐渐增大, 分子总能量和谐振频率均先增大后减小; 红外谱强度则先减小后增大, 在 F = 0.03 a.u. 时, 取得最小值 0.1138 km·mol<sup>-1</sup>. 由基态到第 1—10 个单重激发态的波长均随着正向电场的增大而增大. 激发能均随着正向电场的增大而减小. 电场的引入可改 变 SnSe 分子激发态出现的顺序并使得一些禁止的跃迁变得可能.

关键词: SnSe, 外电场, 能隙, 激发特性 PACS: 31.15.es, 33.15.Fm, 31.30.jp, 32.30.-r

# 1引言

由第四主族元素 (Ge, Sn 和 Pb) 和第六主族 元素 (S, Se 和 Te) 所构成的化合物由于是窄带隙 的半导体,在光电领域中有着广泛的应用而备受 人们的关注<sup>[1-4]</sup>.本文的研究对象 SnSe 就是此 类晶体, SnSe 晶体具有层状的正交结构, 在低能 时表现出强烈的各向异性的光学特性,在高能时 则表现出更多的各向同性的光学特性<sup>[5]</sup>.这使得 SnSe 被广泛用于全息记录介质<sup>[6]</sup>,电子开关<sup>[7]</sup>和 红外探测器等<sup>[8]</sup>. 此外, 由于 SnSe 的带隙约 1 eV, SnSe 已被作为一种高效的太阳能电池材料<sup>[9,10]</sup>. 目前对 SnSe 的研究主要集中在晶体的电子结构 和弹性性质 [5,11-14]、光学性质 [15-18]、热力学性 质<sup>[19,20]</sup>及晶体相变<sup>[21-23]</sup>等.而对于气相的 SnSe 分子研究却较有限<sup>[24-26]</sup>. Vago 等<sup>[15]</sup> 利用实验的 方法测得基态 SnSe 分子离解为 Sn( $^{3}P$ )+Se( $^{3}P$ ) 的 离解能 D<sub>e</sub> 为 4.54 eV. Colin 等 <sup>[25]</sup> 利用质谱仪测 得了 Sn(s)+Se(s)→SnSe(s) 和 Sn(s)+Te(s)→SnTe(s)

#### **DOI:** 10.7498/aps.62.073102

的反应焓. Jalbout 等<sup>[26]</sup>利用 Gaussian 98 软件中 的 LSDA/SDD, BLYP/SDD 和 B3LYP/SDD 方法对 SnSe 分子的光谱常数和势能曲线进行了研究.而对 于 SnSe 分子的外场效应,即在外加磁场或电场作 用下研究它们的分子结构及其特性,到目前为止还 未见报道. 众所周知, 在外场作用下电子从基态向 激发态跃迁将使得材料的性质发生极大的改变,分 子在外场作用下产生许多能量较高的次级电子和 分子激发态,进而能量较高的次级电子和激发态电 子发生一系列的化学变化,如新自由基产生、新激 发态生成和化学键的断裂等,而且分子在外场作用 下的特性研究已经被成功用于很多领域<sup>[27-29]</sup>.研 究分子的外场效应对于研究材料分子尤其是光电 材料分子的性质及有目的地指导具有某种特性的 新材料的合成都具有重大的理论和实践指导意义. 本文首先利用密度泛函中的 B3LYP 方法, 优化得 到了 SnSe 基态分子在无场下的稳定构型, 继而使 用含时密度泛函中的 TD-B3LYP 方法研究了分子 的前10个激发态的吸收谱、激发能、振子强度等 激发特性与外场的关系.

<sup>\*</sup>四川省教育厅科研基金(批准号: 09ZC048)资助的课题.

<sup>†</sup>通讯作者. E-mail: fanhouwangyibin@163.com

<sup>© 2013</sup> 中国物理学会 Chinese Physical Society

# 2 理论方法

SnSe 分子结构为  $C_{\infty V}$  构型, 基电子态为  $X^{1}\Sigma^{+}$ . 采用外加有限电场的方法, 将 SnSe 分子置于 Z 轴 上, 沿 Z 轴方向 (Sn-Se 连线) 加一平均电场强度 分别为 2.048, 1.536, 1.024, 0.512, -0.512, -1.024, -1.536, -2.048 GV/m, 即相当于 0.04, 0.03, 0.02, 0.01, -0.01, -0.02, -0.03, -0.04 a.u. 的电偶极化 电场来考察其分子结构及激发特性. 所有的计算 均在 Gaussian 03 软件包进行 <sup>[30]</sup>. 在程序中, 分子 体系的哈密顿量 H 中加入了  $-\mu \cdot F$ ,  $\mu$  为分子的电 偶极距矢量, F 为外电场矢量 <sup>[31]</sup>. 振子强度 f 可表 示为 <sup>[28]</sup>

$$g_1 f_{1u} = \frac{8\pi^2 m c a_0^2 \sigma}{3h} S = 3.03966 \times 10^{-6} \sigma S, \quad (1)$$

其中 S 为线强, S 可表示为

$$S = \left| \left\langle a\Lambda \left\| er \right\| a'\Lambda' \right\rangle \right|^2.$$
<sup>(2)</sup>

振子强度  $f_{1u}$  由激发能  $E_u - E_1$  和跃迁电偶极距  $\mu_{1u}$  决定,因此  $f_{1u}$  又可表示为

$$f_{1u} = \frac{8\pi^2 m}{3h^2 e^2} \times (E_u - E_1) \times \left| \mu_{1u} \right|^2.$$
(3)

由于电子仅在具有相同自旋多重度的不同态 间跃迁,因此本文在研究 SnSe 分子的激发态性质 的时候仅考虑具有相同自旋多重度下的电子跃迁.

3 结果与讨论

### 3.1 SnSe 基态分子的稳定构型

对 SnSe 基态分子, 分别选用 QCISD, B3LYP, BLYP, B3P86 和 LSDA 方法与 SDD, CEP-121G, ECP<sup>a)</sup> (Se 原子使用 6-311++G<sup>\*\*</sup> 基组, Sn 使用 SDBcc-pVTZ<sup>[32]</sup> 基组) 和 ECP<sup>b)</sup> (Se 和 Sn 均使用 SDBaug-cc-pVTZ<sup>[32]</sup> 基组) 等基组对其进行了优化计算, 得到的平衡核间距 *R*<sub>e</sub>, 谐振频率 *ω*<sub>e</sub> 和离解能 *D*<sub>e</sub> 列于表 1 中. 计算结果表明采用 B3LYP/ECP<sup>a)</sup> 方 法计算的键长 *R*<sub>e</sub>, 谐振频率 *ω*<sub>e</sub> 和离解能 *D*<sub>e</sub> 分别 为 0.2352 nm, 321.9478 cm<sup>-1</sup> 和 4.5450 eV 与实验 值 <sup>[33]</sup> 0.2325 nm, 331.2 cm<sup>-1</sup> 和 4.54 eV<sup>[15]</sup> 符合较 好, 表明在对 SnS 基态分子进行优化计算时 B3LYP 方法和 ECP<sup>a)</sup> 基组更优于其他方法和基组, 优化的 SnSe 分子结构如图 1 所示.



图 1 优化的 SnSe 分子结构

# 3.2 不同外电场下 SnSe 基态分子的稳定 构型

选用 B3LYP/ECP<sup>a)</sup> 方法, 沿 Z 轴方向 (Sn-Se 连 线) 加一平均电场强度分别为 0.04,0.03, 0.02, 0.01, -0.01, -0.02, -0.03, -0.04 a.u. 的电偶极化电场来 考察其分子结构及其特性. 计算结果表明, 在不同 电场下, SnSe 分子基态仍为<sup>1</sup> $\Sigma$ <sup>+</sup>, 优化得到的键长  $R_{\rm e}$ 、总能 E, 电偶极矩  $\mu$ , 谐振频率  $\omega_{\rm e}$  和红外谱强 度 IR 列于表 2 中. 在得到不同外电场下 SnSe 分子 基态结构的基础上, 分析了电场 F 对 SnSe 分子电 荷分布的影响, 结果如表 3 所示.

从表 2 和表 3 中可以看出, 分子的几何参数与 电场强度的大小与方向有着明显的依赖关系.随 着正向电场 F 的逐渐增大,核间距 Re 先减小,在 F = 0.03 a.u. 时 Re 取得最小值 0.2317 nm, 随着正 向电场 F 的继续增大, Re 又开始增大其规律如图 2 所示. 在外场作用下 SnSe 分子的稳定主要由外场 力和离子键共同作用的结果,离子键的大小与正、 负离子之间的静电引力成正比. 在无外加电场时 Sn 显正电性, Se 显负电性, Sn 的电荷布居数分别为 0.2497, Se 的电荷布居数为 -0.2497. 随着正向电场 的增大,电子朝 Sn 原子方向转移,从而使得 Sn 和 Se 原子周围的电荷布居数减小, 如在 F = 0.01 a.u. 时, Sn 的电荷布居数为 0.0606, Se 的电荷布居数为 -0.0606,此时离子间的引力非常小,起作用的主要 是外场力,在外场力的作用下 Sn 离子沿着场强方 向移动, Se 离子沿着场强的反方向移动, 所以 Re 减 小;此后随着正向电场 F 的继续增大,电子继续朝 Sn 原子方向转移,从而使得 Sn 显负电性, Se 显正

	表	1 无外场时不	无外场时不同方法和不同基组优化得到的 SnSe 基态分子结构参数							
方法	基函数	R <sub>e</sub> /nm	$R_{\rm e}^{\rm Exp}/\rm nm$	$\omega_{\rm e}/{\rm cm}^{-1}$	$\omega_{\rm e}^{\rm Exp}/{ m cm}^{-1}$	$D_{\rm e}/{\rm eV}$	$D_{\rm e}^{\rm Exp}/{ m eV}$			
QCISD	$ECP^{a)}$	0.2352	0.2325 <sup>c</sup>	317.7847	331.2 <sup>c</sup>	7.5697	$4.54^{d}$			
QCISD	$ECP^{b)}$	0.2345		318.6903		4.1569				
QCISD	SDD	0.2464		249.7801		4.0364				
QCISD	CEP-121G	0.2449		254.5275		3.4148				
B3LYP	$\mathbf{ECP}^{\mathbf{a})}$	0.2352		321.9478		4.5450				
B3LYP	$ECP^{b)}$	0.2343		320.7786		4.4453				
B3LYP	SDD	0.2407		298.5017		3.9354				
B3LYP	CEP-121G	0.2389		304.9959		4.0201				
LSDA	$\mathbf{ECP}^{\mathbf{a})}$	0.2358		318.8704		5.7722				
LSDA	$ECP^{b)}$	0.2362		314.1351		5.5599				
LSDA	SDD	0.2424		293.8348		5.1024				
LSDA	CEP-121G	0.2405		300.4793		5.1769				
BLYP	$ECP^{a)}$	0.2377		305.2173		4.7351				
BLYP	$ECP^{b)}$	0.2366		304.6211		2.5082				
BLYP	SDD	0.2432		284.1780		4.2105				
BLYP	CEP-121G	0.2413		290.8783		4.2956				
B3P86	$ECP^{a)}$	0.2344		327.7483		4.6709				
B3P86	$ECP^{b)}$	0.2338		325.9802		4.6243				
B3P86	SDD	0.2398		304.5682		4.1144				
B3P86	CEP-121G	0.2389		305.0212		4.0201				

物理学报 Acta Phys. Sin. Vol. 62, No. 7 (2013) 073102

a) Se 原子: 6-311++g\*\*, Sn 原子: SDB-cc-pVTZ; b) Sn 和 Se 原子: SDB-aug-cc-pVTZ; c) 参考文献 [33]; d) 参考文献 [15].

#### 表 2 不同外场下 SnSe 基态分子的结构参数

F/a.u.	R <sub>e</sub> /nm	E/hartree*	$\mu$ /deb*	$\omega_{\rm e}/{ m cm}^{-1}$	IR intensities/km·mol <sup>-1</sup>
-0.04	0.2696	-2405.1516	-7.7836	148.9705	123.2644
-0.03	0.2519	-2405.0878	-5.2319	229.8717	78.7386
-0.02	0.2437	-2405.0441	-3.6038	274.4596	53.5632
-0.01	0.2386	-2405.0147	-2.3091	303.2049	33.8771
0	0.2352	-2404.9973	-1.1614	321.9478	18.5682
0.01	0.2331	-2404.9912	-0.0848	333.3702	7.7248
0.02	0.2319	-2404.9956	0.9592	338.4638	1.5152
0.03	0.2317	-2405.0104	1.9953	337.4228	0.1138
0.04	0.2323	-2405.0355	3.0429	329.9841	3.7144

\*1hartree = 27.21 eV; 1deb =  $3.33564 \times 10^{-30}$  c.m.

表 3 不同外场下 SnSe 分子基态电荷布居分布

F/a.u.	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01	0	0.01	0.02	0.03	0.04
Sn	1.0927	0.8536	0.6464	0.4452	0.2497	0.0606	-0.1220	-0.2984	-0.4694
Se	-1.0927	-0.8536	-0.6464	-0.4452	-0.2497	-0.0606	0.1220	0.2984	0.4694

电性, Sn 和 Se 原子周围的电荷布居数开始变大 (数 值上), 如在 *F* = 0.02 a.u. 时, Sn 的电荷布居数分别 为 -0.1220, Se 的电荷布居数为 0.1220, 即离子间 的引力增大并且大于外场力,所以  $R_e$  继续减小. 在 F = 0.03 a.u. 时  $R_e$  取得最小,最小值为 0.2317 nm, 其后继续增大场强 Se 离子沿着场强的方向移动,

Sn 离子沿着场强的反方向移动, 所以 Re 增大. 图 3为分子总能量随电场变化的曲线图. 从图 3 中 可以看出,随着正向电场增加,分子总能量逐渐 增大,在F = 0.01 a.u. 时能量达到最大,最大值为 -2404.9912 hartree, 此后, 继续增大电场强度, 系统 总能量则开始降低. 这是由于电子朝 Sn 原子方向 转移,从而使得 Sn 和 Se 原子周围的电荷布居数减 小,在F=0.01 a.u.时, Sn的电荷布居数为 0.0606, Se 的电荷布居数为 -0.0606, 此时离子间的库仑引 力非常小,从而使得体系的哈密顿量 H 中的势能 减小(数值上),进而导致体系的总能量升高.其后 随着正向电场的继续加大, Sn 和 Se 的电荷布居数 逐渐增大,从而使得体系的哈密顿量 H 中的势能 增大(数值上)从而使得体系的总能量降低,所以 分子总能 E 减小. SnSe 基态分子的分子偶极矩 u 随电场的变化关系如图 4 所示. 随着正向电场的 逐渐增大, µ 近似线性地增大, 这表明随着正向电 场的逐渐增大分子极性变大,分子的对称性逐渐 降低.



图 5 和图 6 分别列出了 SnSe 基态分子的谐

振频率和红外谱强度随外电场的变化. 随着正向 电场逐渐增大,谐振频率先增大,在F = 0.02 a.u. 时,取得最大值 338.4638 cm<sup>-1</sup>,其后随着正向电场 继续增大谐振频率开始减小,且减小的幅度呈增 大的趋势. 红外谱强度随着正向电场增大先减小, 在F = 0.03 a.u. 时,取得最小值 0.1138 km·mol<sup>-1</sup>, 其后随着正向电场继续增大红外谱强度开始 增大.







图 5 谐振频率在外电场作用下的变化图





## 3.3 外电场对分子能级的影响

在优化得到不同外电场下 SnSe 分子基态稳 定结构的基础上,本文还计算了其最低空轨道 (LUMO) 能量  $E_{L}$ , 最高占据轨道 (HOMO) 能量 E<sub>H</sub>, 能隙 E<sub>g</sub> 和费米能级 E<sub>F</sub>, 列于表 4 中, 其中  $E_{\rm g} = E_{\rm L} - E_{\rm H}, E_{\rm F} = E_{\rm H} + (E_{\rm L} - E_{\rm H})/2$ . SnSe 基态 分子在不同外电场下的最低空轨道能级分布和最 高占据轨道能级如图 7 所示. 由于分子参与化学 反应,优先起作用的是最低空轨道 (LUMO) 和最高 占据轨道 (HOMO). LUMO 能级在数值上与分子的 电子亲和势相当, LUMO 能级越低, 该分子接受电 子能力越强. HOMO 能级反映了分子失去电子能 力的强弱, HOMO 能级越高, 该分子就越容易失去 电子. 而能隙 Eg 的大小反映了电子从占据轨道向 空轨道发生跃迁的能力,在一定程度上代表了分 子参与化学反应的能力<sup>[34]</sup>.从表 4,图 7 和图 8 中 可以看出: 无外场时, EL 和 EH 分别为 -0.1035 和 -0.2527 hartree, 此后随着正向电场的逐渐增大, EL 与 EH 均随着正向电场的增大而减小, 且 EL 减小 的幅度较 E<sub>H</sub> 减小的幅度更大;随着反向电场的增 大, E<sub>H</sub> 一直减小, 但 E<sub>L</sub> 先增大, 在 F = -0.01 a.u. 时, EL 取得最大值, 其值为 -0.1023 hartree, 其后继 续增大反向电场 EL 开始减小且 EL 减小的幅度较 EH 减小的幅度更大. 这意味着能隙 Eg 随着反向电 场的增大,先增大在 F = -0.03 a.u. 时,  $E_g$  取得最 大值 4.2099 eV;其后随着反向电场的继续增大, Eg 迅速减小, 如在 F = -0.04 a.u. 时,  $E_g = 2.3149$  eV. 能隙 Eg 随外电场变化的规律见图 8. 费米能级 EF 和能隙 Eg 随着正向电场的增大始终处于减小趋 势,这也意味着占据轨道的电子易于被激发至空轨 道,形成空穴,使得 SnSe 分子更容易被激发,我们 预计将 SnSe 分子处于强的正向电场下 (或给其施 加电场强度 F > 0.03 a.u. 的反向电场),其效果将 更佳,这也许就是其在光电领域和太阳能电池中广 泛应用的原因. 值得提及的是我们计算的无外场时 的  $E_g = 4.0608 \text{ eV}$ , 与实验值约 1 eV 存在一定的差 距,这主要是由于我们研究的对象是气态 SnSe 分 子, 而实验对象是 SnSe 晶体, 前面计算的结果已经 表明我们采用方法的正确性, 所以我们对 SnSe 体 系定性描述的结果是可信的.

## **3.4** 外电场对激发能和振子强度的影响

在前面研究的基础上,采用 TD-B3LYP/ECPa)

方法研究了同样外电场下由基态到第 1—10 个单 重激发态的波长 (λ), 振子强度 (*f*) 和激发能 (Δ*E*), 计算结果如表 5 和表 6 所示.

表 4 不同外场下 SnSe 基态分子的分子最高占据轨道能量、 最低空轨道能量、能隙和费米能级

F/a.u.	$E_{\rm H}$ /hartree	$E_{\rm L}$ /hartree	$E_{\rm g}/{\rm eV}$	$E_{\rm F}/{\rm eV}$
-0.04	-0.2822	-0.1971	2.3149	-6.5217
-0.03	-0.2680	-0.1366	3.5742	-5.5053
-0.02	-0.2597	-0.1050	4.2099	-4.9630
-0.01	-0.2551	-0.1023	4.1571	-4.8626
0	-0.2527	-0.1035	4.0608	-4.8460
0.01	-0.2521	-0.1074	3.9378	-4.8911
0.02	-0.2530	-0.1135	3.7952	-4.9869
0.03	-0.2552	-0.1216	3.6371	-5.1264
0.04	-0.2586	-0.1313	3.4638	-5.3048



图 7 最高占据轨道能级和最低空轨道能级在外电场作用下的 变化图



图 8 能隙在外电场作用下的变化图

从表 5 和表 6 中的数据可以看出:激发能均随 着正向电场的增大而减小.由基态到第 1—10 个单 重激发态的波长均随着正向电场的增大而增大.在 无外场情况下由基态到第 1—3 激发态振子强度均 为零, 属禁阻跃迁. 而在不同方向与不同强度的外场作用下激发态的振子强度都将发生不同程度的变化. 例如基态至第 1—3 激发态在无外场时振子强度为零, 不能跃迁, 而当反向电场大于 0.03 a.u. 时, 振子强度均不为零, 基态至第 1—3 激发态都能产生电子跃迁, 例如对第 1 个激发态在 F = -0.03 a.u. 时, f = 0.0173, F = -0.04 a.u. 时, f = 0.0092.

还有有些本身是被允许的跃迁,但在加了外电场后 就不能跃迁,例如在无外场时,基态至第4激发态 的振子强度 f 为 0.0132,但在 F = -0.03 a.u. 时,振 子强度为零,不能跃迁.电场的引入还改变了 SnSe 分子激发态出现的顺序,例如在无外场时第1个激 发态为<sup>1</sup> $\Sigma$ <sup>+</sup>态,而当反向电场大于 0.03 a.u. 时第1 个激发态为<sup>1</sup> $\Pi$ 态.

表 5	SnSe 分子在不同外场	下作用下前10	个单重激发态的波长()	<li>い和振子强度(f)</li>
-----	--------------	---------	-------------	--------------------

F/a.u.	0		C	0.01		0.	02	0.03			0.04		
	λ/nm	f	λ/nm	f	-	λ/nm	f	λ/nm	f		λ/nm	f	
n = 1	434.49	0	470.99	0		509.43	0.0000	549.67	0.0000		591.56	0.0000	
n = 2	402.77	0.0000	429.60	0.0000		456.57	0.0000	483.45	0.0000		510.10	0.0000	
n = 3	402.77	0.0000	429.60	0.0000		456.57	0.0000	483.45	0.0000		510.10	0.0000	
n = 4	357.78	0.0132	368.13	0.0126		376.68	0.0118	383.53	0.0110		388.83	0.0102	
n = 5	357.78	0.0132	368.13	0.0126		376.68	0.0118	383.53	0.0110		388.83	0.0102	
n = 6	273.56	0.1160	280.48	0.1192		287.42	0.1167	294.21	0.1127		300.82	0.1085	
n = 7	210.86	0.0852	210.39	0.0519		216.23	0.0245	224.51	0.0133		233.82	0.0088	
n = 8	210.86	0.0852	210.39	0.0519		216.23	0.0245	224.51	0.0133		233.82	0.0088	
n = 9	187.95	0.1267	189.57	0.1558		189.33	0.1804	187.58	0.1908		184.85	0.1958	
n = 10	187.95	0.1267	189.57	0.1558		189.33	0.1804	187.58	0.1908		184.85	0.1958	
F/a.u.	-0	0.01	_	-0.02		-0.03		-0.04		_			
	λ/nm	f	λ/nm	f		λ/nm	f	λ/nm	f	-			
n = 1	400.06	0.0000	367.93	0.0000		397.27	0.0173	566.76	0.0092				
n = 2	376.34	0.0000	350.72	0.0000		397.27	0.0173	566.76	0.0092				
n = 3	376.34	0.0000	350.72	0.0000		373.59	0.2665	477.08	0.3597				
n = 4	345.52	0.0135	331.21	0.0119		338.65	0.0000	313.45	0.0000				
n = 5	345.52	0.0135	331.21	0.0119		326.65	0.0000	305.49	0.0000				
n = 6	267.43	0.0860	290.98	0.0325		326.65	0.0000	305.49	0.000				
n = 7	232.17	0.0594	290.98	0.0325		314.24	0.0114	294.94	0.0031				
n = 8	232.17	0.0594	282.40	0.0929		314.24	0.0114	294.94	0.0031				
<i>n</i> = 9	212.80	0.4771	251.68	0.4288		249.90	0.2914	245.35	0.3067				
n = 10	188.61	0.1435	200.71	0.0000		215.11	0.0000	224.79	0.1317				

表 6 SnSe 分子前 10 个单重激发态的激发能 (ΔE) 与外场的关系

	state					$\Delta E$ /eV						
<i>F</i> /a.u.	n = 1	2	3	4	-	5	6	7	8	9	10	
-0.040	2.1876	2.1876	2.5988	3.9555		4.0586	4.0586	4.2037	4.2037	5.0533	5.5155	
-0.030	3.1209	3.1209	3.3187	3.6611		3.7957	3.7957	3.9456	3.9456	4.9614	5.7638	
-0.020	3.3697	3.5352	3.5352	3.7434		3.7434	4.2609	4.2609	4.3904	4.9262	6.1773	
-0.010	3.0991	3.2945	3.2945	3.5883		3.5883	4.6362	5.3403	5.3403	5.8262	6.5736	
0	2.8536	3.0783	3.0783	3.4654		3.4654	4.5323	5.8798	5.8798	6.5966	6.5966	
0.010	-2.6324	2.8860	2.8860	3.3679		3.3679	4.4204	5.8930	5.8930	6.5404	6.5404	
0.020	-2.4338	2.7156	2.7156	3.2915		3.2915	4.3137	5.7338	5.7338	6.5487	6.5487	
0.030	2.2556	2.5646	2.5646	3.2327		3.2327	4.2141	5.5224	5.5224	6.6095	6.6095	
0.040	2.0959	2.4306	2.4306	3.1886		3.1886	4.1216	5.3026	5.3026	6.7074	6.7074	

# 4 结 论

本文分别采用密度泛函中的 B3LYP 方法和含时密度泛函中的 TD-B3LYP 方法研究了 SnSe 基态分子在无场下的稳定构型和激发态性质.分析了外电场对 SnSe 基态分子键长、总能量、能级、谐振频率和红外光谱强度的影响以及外电场对 SnSe 分子前 10 个激发态的吸收谱、激发能、振子强度等激发特性的影响.结果表明:随着正向电场 *F* 的逐渐增大,核间距  $R_e$  先减小后增大,在 F = 0.03 a.u. 时  $R_e$  取得最小值 0.2317 nm; 分子总能量则先增大后减小,在 F = 0.01 a.u. 时能量取得最大值

-2404.9912 hartree; 分子电偶极矩  $\mu$  近似线性地 增大;  $E_L$ ,  $E_H$ , 费米能级  $E_F$  和能隙  $E_g$  均减小. 随 着正向电场逐渐增大, 谐振频率先增大后减小, 在 F = 0.02 a.u. 时, 取得最大值 338.4638 cm<sup>-1</sup>; 红外 谱强度则先减小后增大, 在 F = 0.03 a.u. 时, 取得 最小值 0.1138 km·mol<sup>-1</sup>. 外电场对 SnSe 分子的激 发能、振子强度及激发态的波长均有较大影响. 激 发能均随着正向电场的增大而减小. 由基态到第 1—10 个单重激发态的波长均随着正向电场的增大 而增大. 电场的引入使得一些禁止的跃迁变得可能, 同时还改变了 SnSe 分子激发态出现的顺序.

- Akifumi O, Ichiro S, Yasuhiko F, Nobuo M, Shunji S 1997 *Phys. Rev.* B 56 7935
- [2] White M G, Rosenberg R A, Tlee S, Shirley D A 1979 J. Electron. Spectrosc Relat Phenom 17 323
- [3] Drummond G, Barrow R F 1952 Proc. Phys. Soc. A 65 277
- [4] Duan W H, Gu B L, Zhu J L1990 Acta Phys. Sin. **39** 437 (in Chinese) [段文晖, 顾秉林, 朱嘉麟 1990 物理学报 **39** 437]
- [5] Nariya B B, Dasadia A K, Bhayani M K, Patel A J, Jani A R 2009 Chalcogenide Letters 10 549
- [6] Singh J P, Bedi R K 1990 J. Appl. Phys. 68 2776
- [7] Loferski J J 1956 J. Appl. Phys. 27 777
- [8] Rodoat M 1975 Acta Electronica 18 345
- [9] Rodoat M 1977 Rev. Phys. Appl. 12 411
- [10] Parentau M, Carlone M 1990 Phys. Rev. B 41 5227
- [11] Nabi Z, Kellou S, Méçabih S, Khalfi A, Benosman N 2003 Materials Science and Engineering B 98 104
- [12] Car R, Ciucci G, Quartapelle L 1978 Physica Status Solidi (b) 86 471
- [13] Bhatt V P, Gireesan K, Desai C F 1989 Crystal Research and Technology 24 187
- [14] Schlecht S, Budde M, Kienle L 2002 Inorg. Chem. 41 6001
- [15] Baumgardner W J, Choi J J, Lim Y F, HanrathT 2010 J. Am. Chem. Soc. 132 9519
- [16] Taniguchi M, JohnsonR L, Ghijsen J, Cardona M 1990 Phys. Rev. B 42 3634
- [17] Franzman M A, Schlenker C W, Thompson M E, Brutchey R L 2010 J. Am. Chem. Soc. 132 40601
- [18] Dang T Q 1984 Physica Status Solidi (a) 86 421
- [19] Safak H, Merdan M, Yüksel öF 2002 Turk. J. Phys. 26 341

- [20] Heribert W, Frank J, Csillag 1979 Z Kristallogr 149 17
- [21] AdoubyK, Pérez-Vicente C, Jumas J C, Fourcade R, Touré A A 1998 Z. Kristallogr 213 343
- [22] Makinistian L, Albanesi E A 2009 physica status solidi (b) 246 183
- [23] Walsh A, Watson G W 2005 J. Phys. Chem. B 109 18868
- [24] Vago E E, Barrow R F 1946 Proc. Physic. Soc. 58 538
- [25] Colin R, Drowart J 1946 Trans. Faraday Soc. 60 673
- [26] Jalbout A F, Li X H, Abou-Rachid H 2007 Int. J. Quantum Chem. 107 522
- [27] Xu G L, Liu X F, Xie H X, Zhang X Z, Liu Y F 2011 Chin. Phys. B 20 013101
- [28] Xu G L, Xie H X, Yuan W, Zhan X Z, Liu Y F 2012 Acta Phys. Sin. 61 043104 (in Chinese) [徐国亮, 谢会香, 袁伟, 张现周, 刘玉芳 2012 物理学报 61 043104]
- [29] Xu G L, Xiao X H, Liu Y F, Sun J F, Zhu Z H 2007 Acta Phys. -Chim. Sin. 23 746 (in Chinese) [徐国亮, 肖小红, 刘玉芳, 孙金锋, 朱正和 2007 物理化学学报 23 746]
- [30] Frisch M J Trucks G W Schegd H B 2003 Gaussian 03, Revision B03. Pittsburgh PA: Gaussian Inc.
- [31] Xu M, Ling H R F, Li Y F, Yang X D, Wang X L 2012 Acta Phys. Sin. 61 093102 (in Chinese) [徐梅, 令狐荣锋, 李应发, 杨向东, 王晓璐 2012 物理学报 61 093102]
- [32] Martin J M L, Sundermann A 2001 J. Chem. Phys. 114 3408
- [33] Huber K P, Herzberg G 1979 Molecular Spectra and Molecular Structure (Vol. 4) Eds.: New York, p.618
- [34] Xu G L, Liu Y F, Sun J F, Zhang X Z, Zhu Z H 2007 Acta Phys. Sin 56 5704 (in Chinese) [徐国亮, 刘玉芳, 孙金锋, 张现周, 朱正和 2007 物理学报 56 5704]

# The ground state properties and excitation properties for the SnSe molecule under different external electric fields\*

Wang Fan-Hou<sup>†</sup> Huang Duo-Hui Yang Jun-Sheng

(Yibin University Key Laboratory of Computational Physics, Yibin University, Yibin 644000, China)

(Received 11 September 2012; revised manuscript received 4 December 2012)

#### Abstract

Effects of electric field ranging from -0.04 to 0.04 a.u., on the equilibrium structure, mulliken atomic charges, the highest occupied molecular orbital(HOMO) energy level, the lowest unoccupied molecular orbital(LUMO) energy level, energy gap, fermi energy, harmonic frequency and infrared intensities of SnSe ground state molecule are investigated by employing density functional (B3LYP) method with SDB-cc-pVTZ for Sn atom and 6-311++G\*\* basis sets for Se atom. The magnitude and direction of the external electric field have significant effects on these characteristics of SnSe molecule. The results show that the bond length is proved to be first decreasing, and then increasing with the increase of the external field, and the minimum value is 0.2317 nm when the field strength is equal to 0.03 a.u.; electric dipole moment is found to increase linearly with the increase of external field, but the HOMO energy  $E_{\rm H}$ , LUMO energy  $E_{\rm L}$ , energy gap  $E_{\rm g}$  and fermi energy  $E_{\rm F}$  are proved to decrease with the increase of external field. The total energy and harmonic frequency are found to first increase, and then decrease, but the infrared intensities are proved to first decrease, and then increase. The wavelengths from ground state to the first ten excited states are found to increase, but the excited energies are decreasing with the increase of the external field. Meanwhile, the sequence of excited states for SnSe molecule can be changed, and some prohibited transition can be allowed under an external field.

Keywords: SnSe, external electric field, energy gap, excitation properties

PACS: 31.15.es, 33.15.Fm, 31.30.jp, 32.30.-r

**DOI:** 10.7498/aps.62.073102

<sup>\*</sup> Project supported by the Science and Research Foundation of Sichuan Educational Committee, China (Grant No. 09ZC048).

<sup>†</sup> Corresponding author. E-mail: fanhouwangyibin@163.com